文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業

NIMS 微細構造解析プラットフォーム 地域セミナー
-微細組織観察および電顕試料作製のためのイオンビーム応用技術-

主催　：NIMS微細構造解析プラットフォーム
日時　：2016年1月19日（火） 13:30～17:30（受付13:00～）
場所　：物質・材料研究機構 千現地区 先進構造材料研究棟5F
参加費：無料
定員　：60名（定員に達し次第参加締切と致します。）

現在では、微細組織の観察やTEM試料の作製等の目的で、様々なイオンビーム技術が応用されています。
そこで今回の地域セミナーでは、イオンビーム技術の微細組織・構造観察への応用をテーマとして、全体の俯瞰と今後の応用への展望について特に最新の技術についての解説を各メーカーからしていただき、その方向性を概観します。

【プログラム 】

講演会（13:30 ～17:00）

13:30-	趣旨説明　（NIMS　原 徹）
13:30- 13:40	微細構造解析プラットフォーム紹介（NIMS　竹口 雅樹）
13:40- 14:10	チュートリアル：「観察装置としてのFIB・加工装置としてのFIB」（日立ハイテクサイエンス　中谷 郁子）
14:10- 14:40	プラズマ型FIBを搭載したデュアルビームの紹介とその応用（日本エフイー・アイ株式会社　村田 薫）
14:40- 15:10	レーザ加工機付FIB-SEMによる大型サンプルの高スループット断面解析（株式会社 東陽テクニカ　相蘇 亨）
15:10- 15:30	コーヒーブレイク
15:30- 16:00	アルゴンイオンビームを用いた透過及び走査電顕の最新試料作製技術（Fischione Japan, Dr. Yves Maniette）
16:00- 16:30	ブロードイオンミリング装置を用いた2D・3D解析（日本ローパーガタン事業部　藤谷 洋）
16:30- 17:00	ヘリウムイオン顕微鏡技術とその材料観察・制御への応用（NIMS　小川 真一）

見学会（17:00 ～ 17:30）

見学会（FIB-SEM、ヘリウム顕微鏡）

参加申し込み

参加申込み：https://ssl.form-mailer.jp/fms/3c73bd5f284640
締切：1月18日（月）15:00（60名に達し次第参加締切と致します。）

問い合わせ：物質・材料研究機構 微細構造解析プラットフォーム事務局
HP：http://www.nims.go.jp/nmcp/
e-mail: nmcp@nims.go.jp
Tel: 029-859-2139